

产品名称：材料测试系统

产品型号：HD-XMTS2200

## 1、产品功能

### (1) 测量参数

通过点聚焦透镜天线以及控制滑轨运动实现材料：

- 1) 反射率、透波率测量；
- 2) 磁性材料的磁导率测量；
- 3) 非磁性材料的介电常数测量。

### (2) 向导式校准

根据选定的工作频段自动设定矢网的校准参数，提供图形化向导式操作界面，控制矢网和滑轨按预先设置进行到相应校准状态。用户按提示可非常方便完成复杂的矢网校准操作。

### (3) 一维滑轨控制

通过软件控制一维滑轨调整透镜相对材料的距离，完成测量的精准校准。

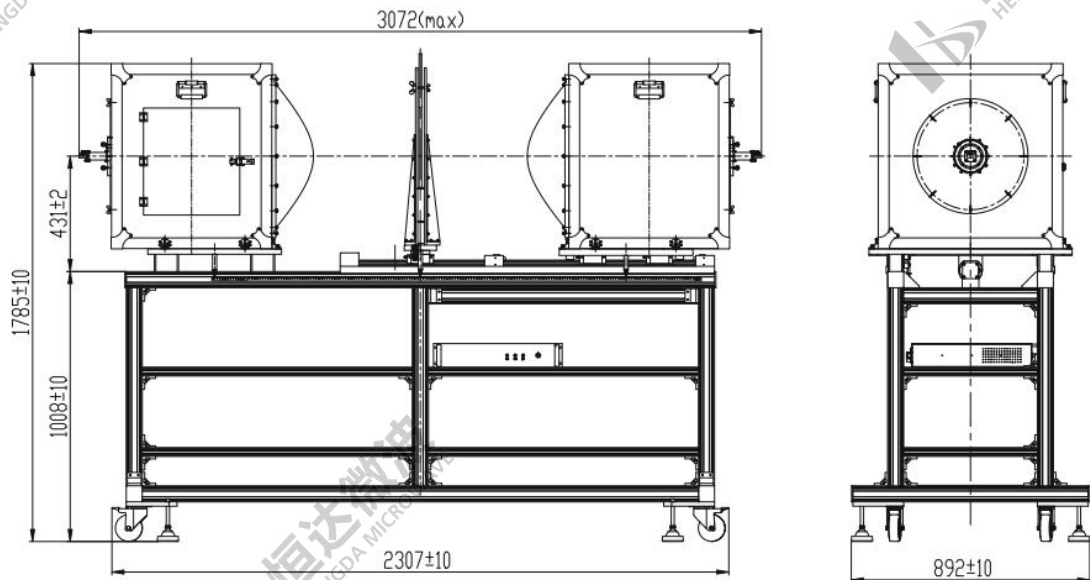
### (4) 可扩展

在材料测试支架下面增加方位旋转台，可以测量材料不同入射角下的参数。

## 2、产品实物图



### 3、产品外形图

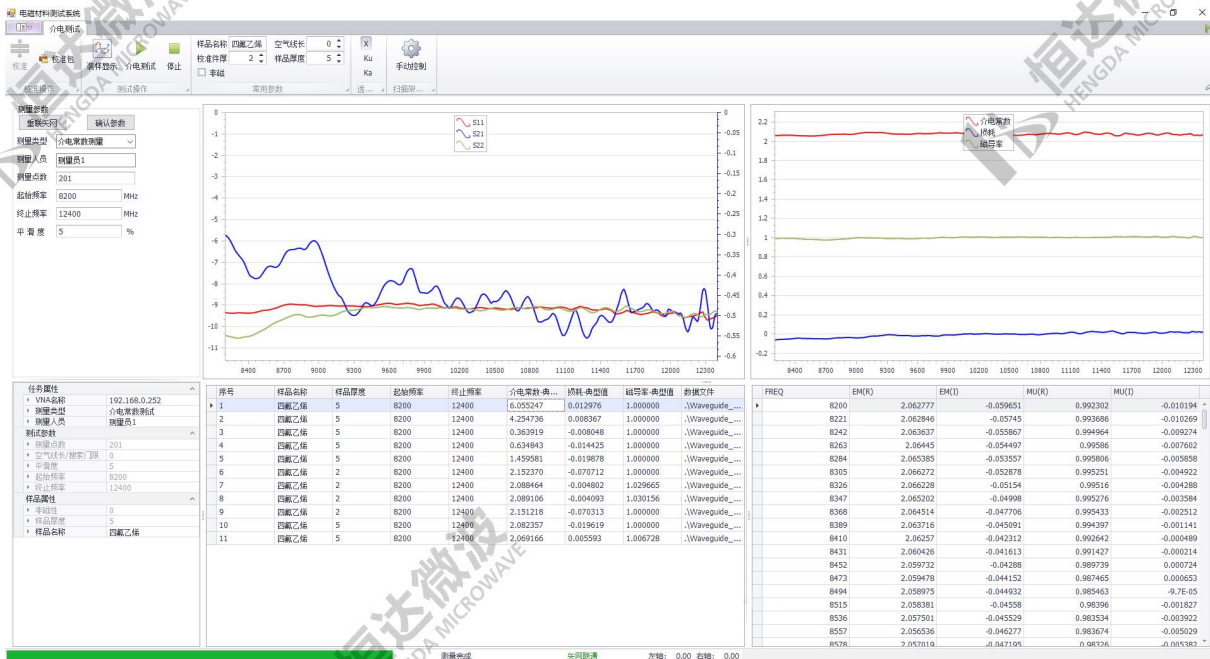


### 4、技术参数

序号	名称	指标
1	测试频率范围	1-40GHz
2	系统动态范围	≥40dB
3	介电常数测量范围	1-100
4	工作方式	扫频测量
5	极化	水平或垂直
6	测量材料类型	平板型
7	材料大小	≥300mm*300mm
8	材料厚度	0.5-20mm
9	控制通信接口	LNA

### 5、测试软件界面

- (1) 与仪表连接通信，控制仪表的频率、采集点数等进行设置；
- (2) 实时曲线显示界面，直观查看当前的测试结果；
- (3) 具有数据图形的保存、处理、输出功能；
- (4) 可根据用户现有仪器进行软件扩展和升级。



版本日期: 2022.5.18